

# LSI Test Systems

## WL15 LSI Test System

WL15は、高精度なDCパラメータ測定、波形解析、時間測定、オーディオ/ビデオ帯域測定などLSIテストのための様々なモジュールを用意し、設計検証および量産工程におけるLSIテストに使用可能なコンパクトなLSIテストシステムです。

ICテストを制御するオペレーティング・システムには、リアルタイムOSを使用し、ユーザ・インターフェースには、世界で広く使用されているWindows OSを採用し、使い慣れた操作性の良い環境を提供しています。プログラミング言語は、シバソクが従来から採用していますC言語（シバソクオリジナルTESTER-C）を使用しています。

また、WL15テストシステムは、デバイス毎のGND (Device Sense Ground)を持つことにより、高精度に4個同時測定を実現しています。

- 同時測定機能
  - 1,2,4個同時測定
  - 4個の独立したデバイスGND (DGS)
  - 2台のハンドラ使用での交互試験
- 高測定精度
  - DC測定精度 : +/-0.05%
  - システム電源から切り離されたモジュール
- 2台のCPUとwindows GUI
  - C言語ベースのシステムソフト
  - デバックツール
- 必要最小限のフロアスペース
  - 15のアプリケーション・モジュール・スロット

- Per-pin Source        +/-32 V/ +/-32 mA x 8ch / Module
- DC Voltmeter        2 inputs, +/-32 V max. (Single),  
±64 V max. (Differential.)
- V/I Source options   +/-50 V/ +/-250 mA  
                             +/-128 V/ +/-250 mA  
                             +/-40 V/ +/-2 A
- Time Measurement   10 ns to 6 sec  
  Resolution        100 ps  
  Accuracy         +/- (10ppm+10ns)
- DSP options        AFG, ADGT, VFG, VDGT
- Parallel Test capability  
                             1 / 2 / 4 DUTs

### Target Applications

Voltage Regulators  
Operational-Amplifiers, Comparators  
MOS-FET  
Audio Amps  
IPD

